

## Contact-less Resistivity Tester

### 非接觸式晶片阻值測試機

以非接觸式渦電流(eddy current)量測晶片或晶棒電阻  
功能簡述如下:

1. 提供**精確量測模式**與**快速量測模式**

精確模式下，需按量測鍵得到精確值。

快速模式下，不需按量測鍵可得到接近的量測值，適合做大量量測時使用。

2. 量測範圍:

高阻: 0.1 ~100 ohm-cm (Ingot)

0.1~ 20 ohm-cm (Wafer)

低阻: 0.001 ~0.1 ohm-cm

3. 量測精度  $\leq 3\%$

(標準片: 0.11 ohm-cm  $\pm$  0.0033)

4. P/N type 也可同時量: One touch

得出 P 或 N 的矽材。

5. 方便的 Ingot 或 Wafer 切換鍵:便於隨時切換，在厚度不變下，可直接量測。

6. 提供 3 個高阻與 2 個低阻標準樣品，以供校驗。

7. 提供 wafer 量測座，方便做大量 wafer 量測，不必隨時拿著 probe。

8. 提供 RS232 溝通介面，可傳 Data 到電腦做儲存。

9. 體積小方便攜帶可在客戶處量測。

